• 材料和元件 •

1986年第3期

非均匀薄膜的一些基本性质

张 范 周九林

一、引盲

从严格意义上讲,任何薄膜都有一定程度的非均匀性。对非均匀薄膜的研究,虽然在五 十年代就曾引起人们的注意,但由于数学处理的繁难,以及制备技术上的原因,非均匀薄膜 并没有得到广泛的研究和应用。目前随着计算机的发展和喜腐镀制技术的成熟,非均匀薄膜 将成为薄膜光学的一个可资开拓的领域。

对于一维非均匀薄膜,由于折射率随厚度按一定的函数关系变化,这给薄膜带来新的特性,并使膜系设计增添了新的可调整的参数,必将演绎出许多新的膜系。

本文对一维非均匀薄膜的基本性质作了初步探讨。

X

则电矢量和磁矢量的复振幅必定满足波动方 程[1]

d²u/dZ²+k²n²u-0 (2) 式中,u为电矢量或磁矢量振幅,k为波数。由 方程(1)、(2)可得

 $d^2 u/dZ^2 + k^2 n^2(0)e^{2\rho z} = 0$ (3)

n(0) n(2) h z

将(3)式与《常微分方程手册》^[2]中标准方程比较,可知方程(3)属于变态 贝 塞 耳 方 程。求解此方程可得到一般解为

$$\mathbf{E}(\mathbf{Z}) = \mathbf{C}_{1} \mathbf{J}_{0} \left[\frac{\mathbf{k}}{\rho} \mathbf{n}(\mathbf{Z}) \right] + \mathbf{C}_{2} \mathbf{Y}_{0} \left[\frac{\mathbf{k}}{\rho} \mathbf{n}(\mathbf{Z}) \right]$$

$$\mathbf{H}(\mathbf{Z}) = -i\mathbf{n}(\mathbf{Z}) \left\{ \mathbf{C}_{1} \mathbf{J}_{1} \left[\frac{\mathbf{k}}{\rho} \mathbf{n}(\mathbf{Z}) \right] + \mathbf{C}_{2} \mathbf{Y}_{1} \left[\frac{\mathbf{k}}{\rho} \mathbf{n}(\mathbf{Z}) \right] \right\}$$

$$(4)$$

收稿日期: 1985年12月18日。

式中, C₁、C₂为常数, J₀、J₁、Y₀、Y₁分别为零阶和一阶的第一类、第二类贝塞耳函数。 代入边界条件 $\begin{cases} \mathbf{E}_{0} = \mathbf{C}_{1} \mathbf{J}_{0}(\alpha) + \mathbf{C}_{2} \mathbf{Y}_{0}(\alpha) \\ \\ \mathbf{H}_{0} = -\operatorname{in}(0) [\mathbf{C}_{1} \mathbf{J}_{1}(\alpha) + \mathbf{C}_{2} \mathbf{Y}_{1}(\alpha)] \end{cases}$ $\mathbf{Z} = \mathbf{0}$ (5) $\begin{cases} E_1 = C_1 J_0(\varepsilon \alpha) + C_2 Y_0(\varepsilon \alpha) \\ H_h = -in(h) [C_1 J_1(\varepsilon \alpha) + C_2 Y_1(\varepsilon \alpha)] \end{cases}$ Zh (6) 从方程组(5)、(6)中消去C₁和C₂,则有 $\begin{cases} E_{0} : aE_{b} + i/n(h) \cdot bH_{b} \\ H_{0} : in(0)gE_{b} + f \cdot H_{b}/\varepsilon \end{cases}$ (7) 式中, $\alpha = kn(0) \cdot h/lne = \frac{2\pi n(0)}{lne} \cdot \frac{h}{\lambda}$ $\epsilon = n(h)/n(0)$ $a = \frac{Y_0(\alpha)J_1(\epsilon\alpha) - J_0(\alpha)Y_1(\epsilon\alpha)}{Y_0(\epsilon\alpha)J_1(\epsilon\alpha) - J_0(\epsilon\alpha)Y_1(\epsilon\alpha)}$ (8) $b = \frac{J_0(\alpha)Y_0(\epsilon\alpha) - J_0(\epsilon\alpha)Y_0(\alpha)}{Y_0(\epsilon\alpha)J_1(\epsilon\alpha) - J_0(\epsilon\alpha)Y_1(\epsilon\alpha)}$ (9) $g = \frac{\mathbf{J}_{1}(\alpha)\mathbf{Y}_{1}(\varepsilon\alpha) - \mathbf{J}_{1}(\varepsilon\alpha)\mathbf{Y}_{1}(\alpha)}{\mathbf{Y}_{0}(\varepsilon\alpha)\mathbf{J}_{1}(\varepsilon\alpha) - \mathbf{J}_{0}(\varepsilon\alpha)\mathbf{Y}_{1}(\varepsilon\alpha)}$ (10) $f = \frac{Y_0(\epsilon\alpha)J_1(\alpha) - J_0(\epsilon\alpha)Y_1(\alpha)}{Y_0(\epsilon\alpha)J_1(\epsilon\alpha) - J_0(\epsilon\alpha)Y_1(\epsilon\alpha)}$ (11)根据基本方程组(7)可得此类非均匀薄膜的特征矩阵为 $\begin{bmatrix} \mathbf{M}_{12} \\ \mathbf{M}_{12} \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{a} & -\frac{1}{\mathbf{n}(\mathbf{h})^{\mathbf{b}}} \\ \mathbf{n}(\mathbf{h})\mathbf{g} & \mathbf{f}/\varepsilon \end{bmatrix}$ (12)如果媒质的折射率分布如图 2 所示,即 $\mathbf{n}(\mathbf{Z}) = \mathbf{n}(\mathbf{0}) \mathbf{e}^{-p\mathbf{z}}$ N(0) 与前述准导比较,很容易得到变化关系 n(Z) $\alpha \rightarrow - c \alpha$ n(h) $\varepsilon \alpha \rightarrow - \alpha$ 由贝塞耳函数性质[3] $\mathbf{J}_{n}(-\alpha) = (-1)^{n} \mathbf{J}_{n}(\alpha)$ $\mathbf{J}_{\mathbf{n}}(\alpha)\mathbf{Y}_{\mathbf{n}}'(\alpha) - \mathbf{J}_{\mathbf{n}}'(\alpha)\mathbf{Y}_{\mathbf{n}}(\alpha) = \frac{2}{\pi\alpha}$

可以得到

· 25 ·

h

图 2

$$J_{0}(-\alpha) = J_{0}(\alpha)$$

$$Y_{0}(-\alpha) = Y_{0}(\alpha)$$

$$J_{1}(-\alpha) = -J_{1}(\alpha)$$

$$Y_{1}(-\alpha) = -Y_{1}(\alpha)$$
(13)

以及

$$J_{1}(\alpha)Y_{0}(\alpha) - J_{0}(\alpha)Y_{1}(\alpha) = -\frac{2}{\pi\alpha}$$
(14)

将以上五个关系式代入特征矩阵的表示式,可得图 2 所示的非均匀薄膜的特征矩阵为

$$M = \begin{pmatrix} M_{11} & M_{12} \\ M_{21} & M_{22} \end{pmatrix} = \frac{1}{\epsilon} \begin{pmatrix} f & \frac{1}{n(0)}b \\ in(h)g & \epsilon a \end{pmatrix}$$
(15)

三、非均匀薄膜的几个基本性质

1. 特征矩阵的行列式值为1

众所周知,均匀薄膜的特征矩阵的行列式值等于1。若将非均匀薄膜看成是由许多层薄的均匀膜叠加组成,则非均匀膜的特征矩阵便是由许多个行列式值为1的二阶矩阵的乘积, 所以非均匀薄膜特征矩阵的行列式值亦为1。关于这一点,我们可以从数学上加以证明。

利用(12)式,可以得到

$$detM = a \cdot f/\epsilon + n(0) \cdot b \cdot e/n(h)$$

$$= (af + bg)/\epsilon$$
将(8)、(9)、(10)、(11) 式代入上式、再利用(13)、(14) 式,可以得到

$$detM = \frac{1}{\epsilon} \left(\frac{\pi\epsilon\alpha}{2}\right)^2 \left[J_1(\alpha)Y_0(\alpha) - J_0(\alpha)Y_1(\alpha)\right] \cdot \left[J_1(\epsilon\alpha)Y_0(\epsilon\alpha) - J_0(\epsilon\alpha)Y_1(\epsilon\alpha)\right] + \frac{1}{\epsilon} \cdot \left(\frac{\pi\epsilon\alpha}{2}\right)^2 \cdot \left(-\frac{2}{\pi\epsilon\alpha}\right) \cdot \left(-\frac{2}{\pi\epsilon\alpha}\right) = 1$$
这個从数学上论证了这一特质、我们利用IBM-PC微型机从数字计算上也证明了这一表

这便从数学上论证了这一性质。我们利用IBM-PC微型机从数字计算上也证明了这一基本性质。

2.反射相移

将图1所示的非均匀薄膜,镀在折射率为n。的基片上,则膜系的特征矩阵为

$$\begin{bmatrix} B \\ C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} M_{11} & M_{12} \\ M_{21} & M_{22} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ n_s \end{bmatrix}$$

反射系数 r $\frac{n_o - C/B}{n_o + C/B} = |\mathbf{r}| e^{i\phi}$

容易得到反射相位

$$\varphi = \operatorname{arctg} \left[\frac{2n_0 (n^2, M_{12}M_{22} - M_{11}M_{21})}{n_0^2 (M_{11}^2 + M_{12}^2 n_1^2) - (M_{22}^2 n_1^2 + M_{21}^2)} \right]$$
(16)

利用IBM-PC微机编程序计算,得到φ~λ曲线,同时计算出相应的均匀薄膜情况,作为 ·26 ·





图 3 虚线对应均匀薄膜情形,实线 Ⅰ 对 应图 1 所示情形,实线 Ⅱ 对应图 2 所示情形

均匀薄膜的折射率为n=2.3,光学厚度为 $\lambda_0/4$;非均匀薄膜则如图1、图2所示,取n(0)=1.8,n(h)=2.3,平均光学厚度nd= $\lambda_0/4$; λ_0 =5300Å。

从图 3 的曲线不难看出,单层非均匀薄膜的反射相移与均匀薄膜比较,相当于中心波长有所偏移,曲线形状很相似。

3. 三层对称非均匀组合膜 薄膜系统的结构如图4所示。 折射率分布为: (n(Z) n(0)epz [[区) n(Z) - n = n(h)(1区) $n(Z) = n(h)e^{-\rho z}$ (Ⅲ区) 对于这种三层组合膜,其特征矩阵为 $M_1 \cdot M_2 \cdot M_3$ 利用(12)、 (15) 式有 i isinð₂/n(h) cosò. f n(h) _1_ $\mu =$ in(0)g in(h)sind, cosò, in(h)g μ_{11} μ_{12}

进行一系列化简后

$$\mu_{11} = \mu_{22} = \frac{1}{\varepsilon} \operatorname{af} \cos \delta_2 - \frac{1}{\varepsilon} \cdot \operatorname{bf} \sin \delta_2 - \frac{1}{\varepsilon} \operatorname{ag} \sin \delta_2 - \frac{1}{\varepsilon} \operatorname{bg} \cos \delta_2$$

且: µ12、µ21为纯虚数

根据前述性质,有 $det\mu = 1$,即 $\mu_{11}^2 + \mu_{12} \cdot \mu_{21} = 1$,故可用三角函数来表示为

$$\mu = \begin{bmatrix} \cos \gamma & i \sin \gamma / E \\ iE \sin \gamma & \cos \gamma \end{bmatrix}$$
(17)

与均匀薄膜情形比较,可知均匀三层对称膜系的等效折射率概念可以运用于非均匀三层 对称膜系,即(17)式中的 E √μ₂₁/μ₁₂ 为等效折射率, Υ为等效相位厚度。 容易证明 这 个结论能够推广到由任意多层非均匀膜组成的对称膜系,这给多层非均匀膜的计算带来很大 的方便。

利用上述理论推导的结果,计算出膜系组构为图4所示的具体例子的等效折射率E,并 与均匀对称组合膜情况比较。均匀三层对称膜组构如图5所示。

取n(0)=1.8, n(h)=2.3, 中心波长 λ_0 -5300Å。



计算出的E~心曲线如图 6 所示,从曲线形状不难看出,均匀膜情况的反射带远远大于 非均匀膜情况,即非均匀膜组构物透明区比均匀组构的大许多。

四、结 语

对非均匀薄膜的研究,我们的工作只是初步的,在这方面还有大量的工作需要去做。

参考文献

- [1] M·玻恩 E·沃耳夫著,杨葭荪等译校,《光学原理》,科学出版社,1978年, 第33页。
- [2] E·卡姆著,张鸿林译,《常微分方程手册》,科学出版社,1980年;第463页。
- [3] 《数学手册》,人民教育出版社,1979年,第636页。